

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21642-01-02 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 04.08.2023

Ausstellungsdatum: 04.08.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-21642-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

MAX STREICHER GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Abteilung SGU-Q (Prüflabor)
Bernrieder Straße 10a, 94559 Niederwinklig

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

mobile Härteprüfung an metallischen Werkstoffen (UCI-Verfahren) sowie Röntgenspektralanalyse

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-21642-01-02

1 Härteprüfung

DIN 50159-1
2022-06

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach dem UCI-Verfahren -
Teil 1: Prüfverfahren

2 Röntgenspektralanalyse

DIN 51418-2
2015-03

Röntgenspektralanalyse - Röntgenemissions- und Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA) - Teil 2: Begriffe und Grundlagen zur Messung, Kalibrierung und Auswertung

Verwendete Abkürzungen:

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
IEC International Electrotechnical Commission